

SAMPLE

検査成績表

〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉	(波形判定器 〈WAVE COMPARATOR〉)	
形名〈Model Number〉	(8730)	
製造番号〈Serial No.〉	(No. 100303502)	
検査年月日〈Test Date〉	(2010-03-03)	
	〈YYYY-MM-DD〉	
検査条件〈Test Conditions〉	(22.0 °C, 48 %rh)	

項目 〈Item〉	レンジ 〈Range〉	検査点 〈Test Point〉	許容範囲 〈Tolerance〉	*2 測定値 〈Measured Value〉
--------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------------

1. 精度〈Accuracy〉

-1. ゼロ位置精度

〈Zero Position〉				CH1 CH2
	100 mV/DIV	0 V	-0.001 V ~ 0.001 V	(0.000 V) (- V)
		*1		

-2. DC振幅精度

〈DC Amplitude〉				CH1 CH2
	100 mV/DIV	1 V	0.995 V ~ 1.005 V	(1.001 V) (- V)
	200 mV/DIV	2 V	1.990 V ~ 2.010 V	(2.000 V) (- V)
	500 mV/DIV	5 V	4.975 V ~ 5.025 V	(5.000 V) (- V)
	1 V/DIV	10 V	9.950 V ~ 10.050 V	(10.000 V) (- V)
	2 V/DIV	20 V	19.900 V ~ 20.100 V	(20.000 V) (- V)
	5 V/DIV	50 V	49.750 V ~ 50.250 V	(50.000 V) (- V)

2. 機能〈Function〉

結果〈Result〉

	CH1	CH2
-1. 時間軸精度〈Time Base Accuracy〉	(PASS)	(-)
-2. 方形波特性〈Square Wave Characteristic〉	(PASS)	(-)
-3. 周波数特性〈Frequency Characteristic〉	(PASS)	(-)
-4. フィルタ動作〈Filter〉	(PASS)	(-)
-5. 入力結合切替〈Coupling〉	(PASS)	(-)
-6. データストレージ、圧縮機能〈Data Storage Compression〉	(PASS)	(-)
-7. トリガ機能〈Trigger Function〉	(PASS)	(-)
-8. ROM/RAMチェック〈ROM/RAM Test〉	(PASS)	
-9. キーチェック〈Key Test〉	(PASS)	
-10. 画面チェック〈Display Test〉	(PASS)	
-11. 外部制御端子〈External Control Terminal〉	(PASS)	

備考〈Note〉

*1 ゼロポジション精度は、入力結合(カップリング)GNDにて校正しています。入力結合(カップリング)GNDとは内部回路で入力とGNDを短絡することです。
 〈The accuracy of the zero position is calibrated by coupling GND. Coupling GND means to short input and GND at the inner circuit.〉

*2 FAIL判定箇所は、グレー表示としています。
 〈FAIL decision points are highlighted in gray.〉

総合判定〈Overall Result〉

(PASS)

検査者〈Inspected by〉

()

承認者〈Approved by〉

()